## **MOSFET**

金屬氧化物半導體場效電晶體

Reported: 台北工程部

Date: April 20th 2018

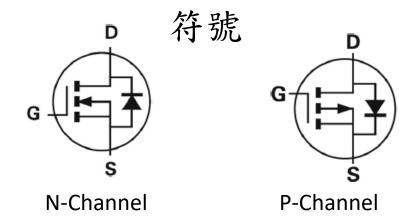
Update: April 20th 2018



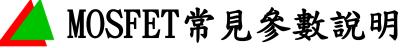
- •1. MOSFET接腳定義及符號
- 2. N(P)-Channel
- 3. MOSFET常見參數說明
- 4. MOSFET 使用須注意事項

## MOSFET 定義三隻接腳;

閘極(Gate-簡稱"G") 源極(Source-簡稱"S") 汲極(Drain-簡稱"D")



- N-Channel
- •當G腳電壓大於S腳電壓達到Vgs(th)\_Max所定義之電壓, D-S將由極高阻抗轉為低阻抗。
- 在規格書內定義N-Channel各特性數值皆以"正"值表示之。
- 電流方向為D流向S。
- P-Channel
- 當S腳電壓大於G腳電壓達到Vgs(th)\_Max所定義之電壓,
  S-D將由極高阻抗轉為低阻抗。
- 在規格書內定義P-Channel各特性數值皆以"負"值表示之。
- 電流方向為S流向D。





- TA:環境溫度
- TC: 封裝表面溫度
- BVDSS: MOSFET崩潰電壓
- ID: 在特定電路環境下最大可承受之電流 (一般將會定義TC與TA溫度及散熱條件下)
- IAS:可承受最大的雪崩雷流
- EAS:可承受最大的雪崩能量
- PD: 最大能承受的消耗功率
- TSTG: 儲存溫度範圍
- TJ: 晶圓最大工作可耐受溫度範圍
- $R \Theta JA$ : 晶圓的熱阻值
- R  $\theta$  JC: 晶圓對封裝表面的熱阻值





- Idss: 當VGS=0時, D-S的漏電流
- Igss:最大VGS所需的電流值
- VGS(th):讓D-S開始導通的最低VGS電壓
- RDS(on): D-S導通後的兩端間的電阻值
- Ciss: Cgs+Cgd
- Coss : Cds+Cgd
- Crss : Cgd
- Td(on)&Td(off) : 導通/關閉的延遲時間
- tr&tf:電壓爬升與下降的時間
- Qg:滿足D-S呈現低阻抗Gate電壓爬升完成, 所需消耗的總電荷量



- Qgs:滿足D-S呈現低阻抗Gate電壓爬升時, G-S間所消耗的電荷量
- Qgd:滿足D-S呈現低阻抗Gate電壓爬升時, G-D間所消耗的電荷量
- VSD:因為半導體N-P介面,MOS未導通時 S-D所形成的二極體導通電壓(VF)
- Trr: S-D所形成的二極體導通時間
- Qrr:S-D所形成的二極體導通所需能量





- 由於MOSFET因製程會產生寄生二極體, 因此在開 關應用中為單向阻斷。
- 有效的防止 MOSFET 並聯時產生自激震盪我們需 要注意以下幾點:
- 1·保持各個 MOSFET 佈線一直性。
- 2 · 各MOSFET需具有獨立的驅動電路, 至少需具備獨立的驅動電阻。
- 3 · 合適的驅動電阻可以阻尼震盪,閘極上磁珠 同樣也可以抑制高頻干擾。



## FAE team

蕭翔文(Alvin) alvin@aeneas.com.tw (02)87974259#628

葉昇晏(Allen) allen.ye@aeneas.com.tw (02)87974259#635

許哲維(Leon) leon@aeneas.com.tw (02)87974259#636

王立文(Leo) leo@aeneas.com.tw (02)87974259#720

高士軒(Johnson) johnson@aeneas.com.tw (02)87974259#637





